

Réunion ThomX

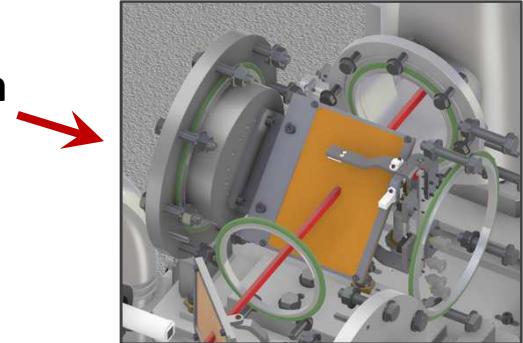
24 juillet 2023

Ligne X

Préparation mesures 24-26/07

2 diodes Det CASEMATE
commissioning ?

- Diodes du Det 2-diodes (casemate) au plus proche du Kapton
(peu d'espoir car : ESRF ~ 40-50 pA à 10⁹ ph/s)



- Transfo : tous les racks remontés

- Fentes 1 et 2 : ouvertes

Spectro CdTe



Resol < 1.5 keV FWHM@ 122 keV

- Positionnement et connexion det CdTe X-Hutch

- Positionnement et connexion Diode calibrée X-Hutch

Si Calibrated diode
→ commissioning



Silicium 300 mm²

- Vérification de la bonne marche des systèmes
de positionnement/alignement

A quoi s'attend-on ? sur la baseline mode désynchro 15 kW, 70 pC e-,
 $f_{tot} = 5.8 \cdot 10^6 \text{ ph/s}$ (mesuré avec det fluo + étalon ESRF)

1. Flux et bw attendu dans le CdTe (25 mm² au point échantillon 10555.9 mm)

$$25 \text{ mm}^2 \rightarrow r_{\text{cercle}} = 2.82 \text{ mm}$$

$$\text{à } D = 10555.9 \text{ mm de l'IP} \rightarrow \theta = 0.27 \text{ mrad}$$

$$\text{FLUX} = f_{tot} * 1.5 * \theta^2 * \gamma^2$$

$$\rightarrow \text{FLUX}_{\text{CdTe}} = 6.4 \cdot 10^3 \text{ ph/s}$$

$$\text{BW} = \text{bw_Compton} (0.07 \%) + 2 * \text{bw_e-}$$

2. Courant attendu dans Diode calibrée (300 mm² au point échantillon 10555.9 mm)

$$300 \text{ mm}^2 \rightarrow r_{\text{cercle}} = 9.77 \text{ mm}$$

$$\text{à } D = 10555.9 \text{ mm de l'IP} \rightarrow \theta = 0.93 \text{ mrad}$$

$$\rightarrow \text{FLUX} = 7.0 \cdot 10^4 \text{ ph/s} \quad (\text{bw_Compton} = 0.83 \%)$$

Conversion courant :

$$\text{Flux (ph/s)} = I_{\text{diode}} (\text{A}) / [\text{réponse (A/W)} \times E_{\text{Xray}} (\text{eV}) \times 1.6 \cdot 10^{-19}]$$

$$I_{\text{diode}} (\text{A}) = 7.0 \cdot 10^4 * [0.020 * 45000 * 1.6 \cdot 10^{-19}]$$

$$\rightarrow I_{\text{diode}} \sim 10.0 \text{ pA}$$



- Mesure taille électrons (table FPC + det Fluo Xrays)

avec cette fois infos Stockage e- + Puissance laser

- Mesure du flux absolu de 2 façons

Det Fluo Casemate avec infos Stockage e- + Puissance laser

Diode calibrée X-Hutch

→ e- bunch charge deduction

$$Fl = \frac{\Sigma_{th} n_e n_L f_{rep}}{2\pi [(x_e^2 + x_L^2) + \tan^2(\theta_c/2)(z_e^2 + z_L^2)]^{1/2} (y_e^2 + y_L^2)^{1/2}}$$

Annotations on the equation:

- A blue arrow labeled "Xrays" points to the first term n_e .
- A blue arrow labeled "Xrays" points to the second term n_L .
- A green arrow labeled "FPC" points to the third term f_{rep} .
- A green arrow labeled "DIAG" points to the fourth term $(y_e^2 + y_L^2)^{1/2}$.
- A green arrow labeled "FPC" points to the fifth term $(z_e^2 + z_L^2)^{1/2}$.
- A green arrow labeled "FPC" points to the sixth term $(x_e^2 + x_L^2)^{1/2}$.

- Mesure du spectre

Det CdTe X-hutch

- Signaux det 2-diodes casemate ?

- Absolute flux measurement
- Xray beam stability measurement (position and intensity)
- Spectral angular distribution reconstruction
- Transfocator **commissioning**
- CMOS camera **Commissioning**
- Monochromator **commissioning**
- X-ray fluo spectro - Metal and powder - Vortex Det **commissioning**
 - In pink beam
 - With Mono
- X-ray diffraction - Cristal and powder - 2D CdTe Det (Dectris) **commissioning**
 - In pink beam
 - With Mono
- Imaging → Source + camera qualification
 - Spatial resolution measurement (source + det) - **Micro-CT bar pattern**
 - MTF measurement - **TO_MTF phantom**
 - Evaluate sensibility to contrast drugs - **Micro-CT contrast scale phantom**
 - Measure contrast and resolution with a single image - **TOR_MAM phantom**
- XANES and EXAFS analysis techniques faisability - **Cristal and powder**
-

First overview of the

- commissioning

- source + det. qualifications